Search	h Note	S

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/856,150	YANG ET AL.
Examiner	Art Unit
Jason M. Perilla	2634

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
375	140	5/23/2005	JP
	146	5/23/2005	JP
	130	5/23/2005	JP
	295		
			•

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		·	
	1		

SEARCH NO (INCLUDING SEARCE)
	DATE	EXMR
East		
USPAT USPGPUB EPO/JPO	5/23/2005	JP
Inventor Name Search EAST/EDAN	5/23/2005	JP
·		
V		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	-	